PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63020726 A

(43) Date of publication of application: 28.01.88

(51) Int. CI

G11B 7/09 G02B 7/11

(21) Application number: 61164646

(22) Date of filing: 15.07.86

(71) Applicant

HITACHI LTD

(72) Inventor:

TSUYOSHI TOSHIAKI TAKASUGI KAZUO OTAKE MABATOSHI YONEZAWA SEIJI

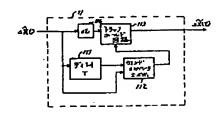
(54) OPTICAL DISK DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To secure the stable control properties of an optical disk device by substituting a sample error signal for the value obtained from the preceding sampled value for a single sampling period if it is decided that said error signal is not appropriate.

CONSTITUTION: The signal $\Delta X(t)$ supplied to a protecting circuit 11 is compared with the sampled value preceding by a step. The normal sampled value is confirmed when the difference obtained from said comparison is kept within a fixed range $\pm \Delta w_1$. Then such a sampled value is available. While the wrongly sampled value is decided if said difference of comparison exceeds the range $\pm \Delta w_1$, therefore the sampled value preceding by a step is used instead. A delay circuit 111 which delays the signal $\Delta X(t)$ by a sampling time T is used together with a window comparator 112 having the width ± \(\Delta \) w for comparison performed between the 1-step preceding sampled value and the present sampled value. A track holding circuit 113 holds an input only for a period during which the comparator 112 decides that the present sampled value is wrong and otherwise transmits the signal $\Delta X(t)$ as it is. Thus it is possible to secure the stable control properties for an optical disk device despite a detection error of a servo signal.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



9 日本国特許庁(JP)

⑩特許出閱公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-20726

@Int_Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988) 1月28日

G 11 B 7/09 G 02 B 7/11

A-7247-5D L-7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

9発明の名称 光ディスク装置

②特 顋 昭61-164646

❷出 願 昭61(1986)7月15日

砂発 明 者 津 吉 敏 明 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

⑫発 明 者 高 杉 和 夫 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

母発 明 者 大 竹 正 利 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

砂発 明 者 米 沢 成 二 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

9代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 胡 由

1. 発明の名称 光ディスク数**段**

2. 特許請求の節頭

1. フォーカシング、トラッキングなどの刻御をサンプリング制御で行なう光ディスク装置において、サンプルした緊急信号値が適正な値か否かをチェックする手限を有し、適正でないと判断した場合は、その緊急信号を一定期間、以前のサンプル値を用いて作成した値に代用するような保護手段を有することを特徴とする光ディスク装置。

3. 発明の詳細な説明

〔商業上の利用分野〕

本発明は光ディスク装置に係り、特に光スポットのフォーカス及びトラッキング制御を耐欠的に かられるサーポ信号により行なう場合に適した席 周波サンプリングサーポ方式を用いた光ディスク 装置に関する。

(従来の技術)

光ディスク上の任意の記録知识にデータをライ

トし、任意の領域からデータをリードする光ディ スク装置に関して、ディスク面とリード、ライト 用光ピームスポットとの関係を正しく制御するこ と、すなわちオート・フォーカス制御およびトラ ッキング制御において、トラック上の特定領域に 間欠的に上記観御のためのサーポ信号領域を設け、 この信号に基づいてサンプリング的に上記制御を 突旋する方式が侵害されている。たとえば特公昭 58-21336号。1984 (昭59) 年。例 45回応用物理学会学術課演会 13p-E-8 および13p-E-9"セクタサーポ方式データ ファイル光ディスク"そのし、その2等である。 これらの方式の特徴は、光ディスクのフォーカス 及びトラッキングサーボにおいて、サーポ信号の 検出を、トラック上から連続的に得るのではなく、 間欠的に得、これを基いサンプリングサーポ方式 とする点である。このためサンプル点以外の部分 からの影響を受けないという利点がある。

たとえば、データピット記録時には一般に読み 、出し時の10倍程度の強度のパルスが光度出層に

特開昭63-20726 (2)

入射するため、速線制御の場合にはこれらのパルスによりフォーカスおよびトラッキングのサーボ 系が乱される恐れがあるが、サンプリングサーボ ガ 式では、サンブル点以外の個母を使用しないので記録パルスの影響は受けない。また、一般に光 ディスクではデータのピットの記録の前後で反射 本などが変化するため、速線制の場合、制御系の特性が変化することがあるが、サンプリンサーボ系では、このような、変化の影響も受けず、サーボ系を安定化できる利点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし上記従来技術においては、光ディスクのフォーカス及びトラッキング制御をサンプリング・サーボ方式で実施する問題が論じられているが、サーボ信号が正しく検出された場合を前提としており、実際のディスクに多数存在する欠かんや、あるいはサーボ系の何らかのエラにもとづくサーボ信号の検出誤りについては記慮されていない。したがってサーボ信号に検出エラがあると、その誤りは少なくとも次にサンプルされるサーボ信号

刊定してサーボ系にそのサンプル値、または代替 データを送りこむまでに要する時間を一定時間内 に終了することによって達成される。なぜなら、 これらの判定に要する時間はサーボ系のむだ時間 として作用するため、この時間を長くとりすぎる とサーボ系の位和余有が減少し、安定性が低下す るからである。

(# m)

本発明に於ては、検出したサーボ信号についてその信号をサーボ系への入力信号とする前に、まずその信号をが認りであるか否かを判定する。それに連続したサーボ信号から改修を対したサーボ信号の取りうる鑑賞等を対し、があるのかであり、大ないかがであればこれを願しいかができました。ない、外であればこれを使し、かっかにより異常なサーボ信号が検出されていた。というのはなからにより異常なサーボ信号が検出されていいている。このたが検出されていたからにより異常なサーボ信号が検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このたが検出されている。このにより異常なサーボ信号が使出ることを対しては、

まで蜂正されることはなく、制御特性が乱れ、所 定の性能をもつ制御系を構成できないという問題 があった。

本務明の目的は、サーボ信号に検出誤りが存在する場合にも、その影響を最少限におさえ、安定な制御特性が保証されるような光ディスク装置を 得ることにある。

[問題点を解決するための手段]

上記目的は、第1にはサーボ信号の検出調りの 発生がそれ程高矩度には起らないこと、すまれな 通常の制御状態に於ける上記エラの発生は趣に於ける上記エラの発生は趣に あるという性質を基とし、正常な類御状態にはおける るサーボ信号の取り得る個差範囲を、連続しては 表の一つまたは複数のサンブルの協力の情報を まの一つまたは複数のサンブルのはから、あるは これにはでし、所定の判定はからの情報を というであるかですが からたサーボ信号が誤りであるかですが かいしたサーボ信号が誤りであるかですが よりの場合には上記標定質によって連成される。

一方、第2としては、上記サンプル値の適否の、

に影響されることなく良好な制御特性を得ること ができる。

上記判定で連線的にあるいは極めて高額度で試りと判定される場合が起る。たとえば大きな 久路 等の場合である。 欠陥に対しては装置の性能から対応できる最大 欠陥はあらかじめ想定できる。 したがって、上記誤りの状盤の数紋状況から変異の

特開昭63-20726 (3)

制御や動作が法を決定することができる。また、このような異常状態(たとえば欠陥部)からの原出の判定は、上記判定対果の誤りが連続して無くなったことを検知するなどにより可能である。このため上記判定の限界領は必ずしも一定ではなく、 状態に応じて可変とすることができる。

 Δ t だけ遅らせた信号となる。信号を Δ t だけ遅らせることは、周波数伝達開教的には、

$$G_{d}(jw) = e^{-Jw\Delta b}$$
 (3)

で汲むされ、その位相特性がよ (w) は

$$\varphi_A (\mathbf{w}) = -\mathbf{w} \cdot \Delta \mathbf{t}$$

$$= -2 \pi \mathbf{f} \cdot \Delta \mathbf{t} \qquad (4)$$

である。したがってサンプルホールドとチェック 時間 Δ t によって発生するトータルの位相遅れ Ψ (f) は (2)。(4) 式から

$$\varphi (f) = \varphi_h (w) + \varphi_A (w)$$

$$= - \{ x \cdot \frac{f}{f} + 2 x f \cdot \Delta t \}$$
(5)

と なる。ここでサンプル間隔 T と Δ ι の比を ŋ で **みわ**し、

$$G_h(jw) = (1-e^{-JwT}) / jwT$$
 (1)

で示され、その位望特性 ゆん (w) は

$$\mathcal{P}_{h} (w) = -T / 2 w$$

$$= -\pi \cdot \frac{f}{f - f} \qquad (2)$$

となる。なおここで、f=2 x w。fs=1/Tである。したがってサンプルホールド要素は一種のローパスフィルタとで動き、その位相遅れ最は周波数に対して終形で、サンプリング周波数(fs)と等しい周波数成分に対して x (180°)遅れ、f=fs/10という周波数成分に対しては180°の位相遅れを発生させる。

一方、前述のように本発明ではサーボ系に思サンプルによる信号が入り、サーボ系が乱されるのを防ぐためサンプルしたデータをチェックするが、チェックに要する時間をΔιとすると、実際にサーボ系に送り込まれる信号は第4回(b)に示すようなΔX(t)となり、これはΔX(l)を

$$\eta = \Delta t / T$$
 (6)

とすると、At=n·T=n/fsより

$$\varphi (f) = -\left(z \cdot \frac{f}{f s} + 2 \pi f \cdot \frac{\eta}{f s}\right)$$

$$= -\left(z + 2 \pi \eta\right) \cdot \frac{f}{f s}$$
(7)

となる.

一般にサーボ系で位相遅れ最が問題とされるのは、サーボ系のゲイン交叉周波数(〔c〕においてであり、これは、サーボ系の関ループ伝達開数のゲインが1となる周波数と定義される。この〔cにおける関ループ系の位相は一末
(一180°)以下であることが、サーボ系の安定条件であり、一180°に遭するまでの余器が、位相合有少mとして定義される。一般に安定性の指揮として

$$\varphi_m > 45$$
 (8)

程度が必要とされるとされている。

一方、光ディスクのフォーカスやトラッキングのサーボ系において、ゲイン交叉周波数 [cは 3 K H z 以下である場合が多い。これは、サーボループの中で光スポットの位置を毎正する機能をもつアクチュエータは機械系であるので、20 K H z 付近の周波数で複共 版と呼ばれる有害な共 版点を有するため、 f cを 3 K H z 程度より大くすると、複共 根点でサーボ系がゲインを有することになり、サーボ系が不安定となりやすくなるためである。

したがって光ディスクサーボ系は、 $f_{c}=1$ K ~ 3 K H $_{z}$ において位相介有 $g_{c}=4$ 5 * 程度を有するものが一般的となっている。

しかるに、サンプリングサーボ系では(7) 式で示されるような位相おくれが加わるため、連続サーボ系に単純にサンプルホールド要数を加えると位相念有 9 m が減少し、サーボ系が不安定となることがある。fs/fc, Δt/Tと位相遅れ9との関係をプロットしたものが第5回である。

$$\varphi(fc) = -180^{\circ} \cdot (1+2\pi) \cdot \frac{fc}{fs} > -40^{\circ}$$
 (9)

を離足し、実用的には左辺が-20 。 程度となるように $\eta = \frac{\Delta t}{T}$ を設定すればよい。

なお、以上はサンプルホールドとして母女ホールドとして計算をしたが、母女ホールド以外、例えば1女ホールドを用いることによりホールド回路による位相遅れは(2) 式より小さくすることは可能である。

(実施例)

以下本元明の一実施級を第1回により設明する。 第1回は本元明における光ディスク装置のブロック図を示す。1はリード・ライト光学へファであり、10、11、~14からなる系統はファーカス制御系、20、21、~24はトラッ式に「カス制御系、20、21、~24はトラッ式に「ひかの類があると、本元明ではよいないないない。 では、なる保護回路手段を有することが特徴である。従って保護回路手段に11、21以外の部分に ついては構成的には健棄技術におけるサンプリン グサーポ方式の光ディスク装置と変らない。すな わち光学ヘッド1は、ディスク上のサーボ信号及 びデータ信号を読み取り、またデータのライト動 作をする。ディスク上の信号からサーボ信号領域 を技取り、フォーカス及びトラッキング制御信号 をサーボ信号検出回路10、20で得る。たとえ ばフォーカス信号検出回路10では非点収発方式 を、トラッキング信号検出回路20ではプリ・ウ オーブル・ピット (Pro-Wobbled pits) 方式 が他川できる。これらサーボ信号は、サーボ信号 領域以外ではホールドしてデータのリード・ライ トを行なう。いま上記サーボ信号のサンプル値を **写次ホールドを行ない、かつ説サンプルのチェッ** クにΔtだけの時間を要するとすると、サーボ系 には (7) 式であらわされる位相おくれず (fc) が現生する。 従って連続制御系にくらべφ (f c) が追加されるから、その遅れを抽借するため、逃 終期母系での傾向要素に加えて、上記サンプリン グ 却御に 塔づく 補償を行なう必要がある。 図の

特開昭63-20726 (5)

12、22はこの両者の位相組備をかねた納道回 路である。ドライバ13,23およびアクチュエ ータ14、24はそれぞれ上記補償回路12、 2 2 の出力により光スポットを制御して、フォー カス及びトラッキング制御を遂行する。上記サン プリング・サーボ方式の光ディスクの従来設置に 於で、サーポ信号の検出に誤りがあると、少なく とも次のサンプル時までは修正されることがない から大きな飼御製剤が生じる。たとえばトラッキ ング閉母においてしサンプルだけ真の誤范信号よ りδ(μπ)分だけ禁ってサンプルしたとすると、 その時のトラックずれAXはその誤サンプルるに よって第2図のような応答を示し、その最大領 a (μm)は第3回の如き物性を示す。ここでパラ メータNは1トラック当りのサンプル数である。 本発明は検出誤りるがあったとき、る→0とす ることができるような保護手段に特徴がある。以

第6回はこの保護回路の一例を示すプロック図 である。破戯で頭んだ部分が保護回路11(また

下この保護回路の供を説明する。

ここでウインドコンパレータのウインド幅 Δ w , は、例えば、サーボ系が許客できる外乱と しての加速度を a とすると、 1 サンプル時間下の 岡に外私によって生じる変位 Δ Y は

$$\Delta Y = \frac{1}{2} a T^2$$

で与えられるので、この値をもとにその他の妥因を考慮して決めてもよい。 仮に a=0.5 G。 $T=30~\mu$ soc とすれば $\Delta~Y=0.002~\mu$ m と なり、 $\Delta~v~\iota$ としては、この母皮の値が目安となる。

なお、第6図の例は前サンプル値との比較を行なうためにアナログ型の遅延素子を用いて保護回路 1 1 を実現したが、阿保の考え方をもつ保護回路は、A/D変換、D/A変換およびメモリカチを用いてディジタル的に行なうことも可能である。この場合もその判定に要する時間がΔ t となる。

第7回は保護回路 i 1 の他の例を示すものである。この例では、n サンプル版字でのn 個の頃を

は22)を示し、この入力はサンプルホールドさ れた信号AX(t)であり、出力はチェックを完 了した信号であるAX'(t)である。本例では 保護回路に入力されたAX(t)は1サンプル前 のサンプル値と比較して、その差が一定の範囲 土△w、であれば、正規の気であると判断して、 そのサンプル戦を使用するが、激が土ムロッを越 える場合には誤サンプルであると判定し、1つ前 のサンプル館を引き絞き使用するものである。Ⅰ サンプル前の値と現在値を比較するために、1サ ンプル時間Tだけ信号AX(t)を遅延させる遅 延回路111と土ムャのウインド幅を有するウイ ンドコンパレータ112を用いる。トラックホー ルド回路113はウインドコンパレータ112に より、現在低が思りであると判定された期間のみ、 入力をホールドし、その他の場合は信号をそのまっ ま通過させる機能を有する。また遅延回路116 は、以上の判定に要する時間Atだけ信号を遅ら せて、割りがある場合に判定巾に繋データがトラ ックホールド回路113を通過するのを防止する

用いて現在、博られるべきサンプル虹の推定値を 発生させ、その推定観と実際に得られる現在鎖を 比較する。比較の結果、その急が土ムw:内であ れば、正しい鎮であると判断し、その雌を採用す るが、差が±△wを越える場合は誤りとして、そ の推定値をその期間使用するようにする。nサン プル前までの鎖によって推定値を作成するために、 時間遅れが下かられてまでの遅延回路111と、 現在旗権定回路114を用い、ウインド幅ム w z のコンパレータ117で現在前と推定値が比較さ れる。そしてウインドコンパレータ117の判定 によってスイッチ115で現在版と推定値の切拾 が行なわれる。この例の保護回路も前例と阅读、 ディジタル回路的な構成でも実現可能であり、現 在領推定回路114の機能を高度化する場合には、 むしろディジタル化した方が気ましい場合がある。

第7回の保護回路は、推定回路1114を工夫することにより、第6回の保護回路よりもより改度の高い保護機能をもたせることが可能となる。

遅延回路のΔι、すなわち以サンプルチェック

特開昭63-20726 (6)

に要する時間は、ホールド回路として写次ホールドを用いる場合(9)式を充分に選足するように
π = Δ ι / Tを設定する。サンプリング周波数
f s = 3 0 K H z . ゲイン交叉周波数 f c =
3 K H z とすれば、第 5 図より、f s / f c =
1 0 より、第 5 図のグラフからΔ t / T = 0 . l
程度とすれば、f c での位相遅れ量 φ (f c) は
ー 2 0 * 程度となり、(9) 式を充分に満足でき、
サーボ的に安定な系を課成できる。なお、Δ t /
T = 0 . 1 とすれば、T = 3 3 μ s o c であるため、

Δ t < 3.3 μ sec

となるように、数サンプルチェックのアルゴリズ ムおよびハードウエアを設計すればよいことになる。

なお、本例の現在競技定回路は n サンプル前ま での数から現在値を算出する構成としたが、必ず しも連続するサンプルを用いなくてもよく、例え ばディスク n 回転前までの同じ位置の銀発信号を

1つの実施例を説明する図である。

〔符号の説明〕

1 … 光学ヘッド、10,20 … 検出回路、11,21 … 保護回路、12,22 … 位相協信回路、13,23 … ドライバ、14,24 … アクチュエータ、 a … 最大トラックずれ最、 b … 33 サンプル母、 N … ディスクー周当りのサンプリング酸、エ … サンプリング B 四級 、 A X (t) … 数差信号の登汰ホールド信号、 f s … サンプリング 周波数、 c c … ゲイン交叉 周波数、 A t … 判定時間、111 … 遅延回路、112,117 … ウインドコンパレータ、113 … トラックホールド回路、114 … 現在領推定回路、115 … 切換スイッチ、116 … A t 遅延回路。

代期人 か度士 小川牌頭

爪いて根定を行なうことも可能である。

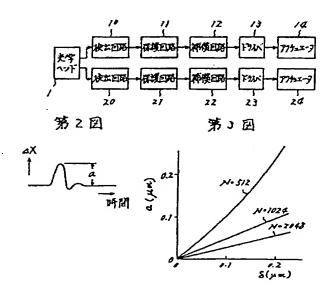
[発明の効果]

本税明によれば、光ディスクファイル装置におけるフォーカス、トラッキングなどサンプリング方式で行なう場合、サンプルした想差信号をチェックすることができるので、ディスクに多少の欠陥等があって正しい誤差信号を検出できなかった場合でも、その欠陥の影響をサーボ系に及ぼすことがなく正しい訓御を行なうことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例の調成を設明する回、 第2回は、サーボ系が1サンプル製サンプルをしたときのサーボ系の応答を設明する回、第3回は サーボ系が8だけ製サンプルしたときのサーボ系の最大応答量 a をプロットしたグラフ、第4回は サンプルホールドおよび判定時回 A t の及ぼす 効 乗を説明する回、第5回はサンプルホールドと遅 延A t によって発生する位相遅れ やの量を設明するグラフ、第6回は本発明の保護回路の一支値例 を説明する回、第7回は本発明の保護回路のもう

第1回.



特開昭63-20726 (7)

